PACS: 77.22.Ch, 77.22.Gm, 77.80.-e

ISSN 1729-4428

I.Р. Зачек¹, Р.Р. Левицький², А.С. Вдович²

Вплив гідростатичного тиску на релаксацію квазіодновимірного сегнетоелектрика GPI

¹Національний університет "Львівська політехніка" вул. С. Бандери 12, 79013, Львів, Україна ²Інститут фізики конденсованих систем НАН України, вул. Свєнціцького, 1, Львів, 79011, Україна

Запропонована динамічна модель деформованих квазіодновимірних сегнетоелектриків з водневими зв'язками типу GPI. На основі цієї моделі в наближенні двочастинкового кластера з врахуванням короткосяжних і далекосяжних взаємодій та деформацій \mathcal{E}_i і \mathcal{E}_5 в рамках методу Глаубера розраховано динамічні діелектричні проникності механічно затиснутого кристалу. Досліджено вплив гідростатичного тиску на температурні і частотні залежності компонент тензора динамічної діелектричної проникності сегнетоелектрика GPI.

Ключові слова: сегнетоелектрики, кластерне наближення, динамічна діелектрична проникність, гідростатичний тиск.

Стаття поступила до редакції 17.05.2017; прийнята до друку 05.06.2017.

Вступ

До сегнетоелектриків з водневими зв'язками належить фосфіт гліцину (GPI). В параелектричній фазі кристал має моноклінну структуру (просторова група $P2_1/a$). Зміни деяких відстаней між іонами в тетраедрах HPO_3 та відповідні складові дипольних моментів водневих зв'язків ланцюжках породжують сумарний дипольний момент вздовж осі Y. При температурі 225 К кристал переходить у сегнетоелектричний стан (просторова група $P2_1$) зі спонтанною поляризацією, перпендикулярною до ланцюжків вод-невих зв'язків.

В роботі [1] на основі запропонованої моделі деформованого кристала наближенні В двочастинкового кластера проведено розрахунок термодинамічних, п'єзоелектричних, пружних і теплових характеристик сегнетоелектрика GPI і отримано хороший кількісний опис ших характеристик, які одержано експериментально. А вплив електричних полів на ці характеристики кристала GPI досліджено в роботі [2].

Метою даної роботи є дослідження впливу гідростатичного тиску на температурні і частотні залежності компонент динамічної діелектричної проникності кристала GPI.

I. Релаксація механічно затиснутого кристалу типу GPI

Динамічні властивості механічно затиснутого кристала GPI при прикладанні електричних полів E_i (i = 1,2,3) і гідростатичного тиску $p = -s_1 = -s_2 = -s_3$ будемо досліджувати на основі динамічної моделі, яка ґрунтується на ідеях стохастичної моделі Глаубера [3]. На основі методики, розвиненої в роботах [4, 5], отримуємо наступну систему рівнянь для залежних від часу функцій розподілу протонів:

$$-a\frac{d}{dt}\langle\prod_{f} s_{qf}\rangle = \sum_{f'} \left\{ \langle\prod_{f} s_{qf} \left[1 - s_{qf'} \operatorname{th} \frac{1}{2} b e_{qf'}^{z}(t) \right] \right\}, \quad (2.1)$$

де $e_{qf'}^{z}(t)$ – локальне поле, що діє на f' -ий протон у q-ій комірці. Щоб отримати замкнуту систему рівнянь, використаємо наближення двочастинкового кластера. В цьому наближенні локальні поля $e_{qf'}^{z}(t)$ є коефіцієнтами при S_{qf} у двочастинкових $\hat{H}_{q}^{(2)}$ і одночастинкових $\hat{H}_{qf}^{(1)}$ гамільтоніанах, котрі одержані в роботах [1,2]:

$$\hat{H}_{q}^{(2)} = -2w \left(\frac{s_{q1}}{2} \frac{s_{q2}}{2} + \frac{s_{q3}}{2} \frac{s_{q4}}{2} \right) - \frac{y_{1}}{b} \frac{s_{q1}}{2} - \frac{y_{2}}{b} \frac{s_{q2}}{2} - \frac{y_{3}}{b} \frac{s_{q3}}{2} - \frac{y_{4}}{b} \frac{s_{q4}}{2},$$

$$\hat{H}_{q2}^{(1)1} = -\frac{\overline{y}}{b} \frac{s_{q1}^{(1)}}{2}, \quad \hat{H}_{q2}^{(1)2} = -\frac{\overline{y}}{b} \frac{s_{q2}^{(2)}}{2},$$

$$\hat{H}_{qf}^{(1)} = -\frac{\overline{y}_{f}}{b} \frac{s_{qf}}{2},$$
(2.2)

де використані такі позначення:

$$y_{1} = b(\Delta_{13} + 2n_{11}h_{1} + 2n_{12}h_{2} + 2n_{13}h_{3} + 2n_{14}h_{4} + m_{13}^{x}E_{1} + m_{13}^{y}E_{2} + m_{13}^{z}E_{3}), h_{f} = \langle s_{qf} \rangle,$$

$$y_{2} = b(\Delta_{24} + 2n_{12}h_{1} + 2n_{22}h_{2} + 2n_{14}h_{3} + 2n_{24}h_{4} + m_{24}^{x}E_{1} - m_{24}^{y}E_{2} + m_{24}^{z}E_{3}),$$

$$y_{3} = b(\Delta_{13} + 2n_{13}h_{1} + 2n_{14}h_{2} + 2n_{11}h_{3} + 2n_{12}h_{4} + m_{13}^{x}E_{1} + m_{13}^{y}E_{2} - m_{13}^{z}E_{3}),$$

$$y_{4} = b(\Delta_{24} + 2n_{14}h_{1} + 2n_{24}h_{2} + 2n_{12}h_{3} + 2n_{22}h_{4} + m_{13}^{x}E_{1} - m_{13}^{y}E_{2} - m_{13}^{z}E_{3}),$$

$$y_{f} = -b\Delta_{f} + y_{f}, \quad b = 1/k_{B}T, \quad (2.4)$$

Тут $\Delta_{13,24}$ – ефективні поля, створені сусідніми зв'язками поза границями кластера.

На основі (2.1) отримуємо такі рівняння в двочастинковому наближенні для залежних від часу унарних функцій розподілу:

$$a\frac{d}{dt}h_{1} = -h_{1} - P_{1}h_{2} + L_{1}, a\frac{d}{dt}h_{2} = P_{2}h_{1} - h_{2} + L_{2},$$
(2.4)
$$a\frac{d}{dt}h_{3} = -h_{3} - P_{3}h_{4} + L_{3}, a\frac{d}{dt}h_{4} = P_{4}h_{3} - h_{4} + L_{4},$$
де використані такі позначення:

$$P_{f} = \frac{1}{2} \left[\operatorname{th} \left(\frac{bw}{2} + \frac{y_{f}}{2} \right) - \operatorname{th} \left(-\frac{bw}{2} + \frac{y_{f}}{2} \right) \right],$$

$$L_{f} = \frac{1}{2} \left[\operatorname{th} \left(\frac{bw}{2} + \frac{y_{f}}{2} \right) + \operatorname{th} \left(-\frac{bw}{2} + \frac{y_{f}}{2} \right) \right]$$

$$w = w^{0} + \sum_{i=1}^{3} d_{2i} e_{i} + d_{5} e_{5}.$$
(2.6)

Аналогічно можна отримати відповідне рівняння і в одночастинковому наближенні:

$$a\frac{d}{dt}h_f = -h_f + th\frac{\overline{y}_f}{2}$$
(2.5)

Обмежимося при розв'язку рівнянь (2.4) і (2.5) випадком малих відхилень від стану рівноваги. Для цього представимо h_f і ефективні поля у ви-гляді суми двох доданків – рівноважних значень і їх відхилень від стану рівноваги:

$$\begin{split} h_{1,3} = \tilde{h}_{13} + h_{1,3t}, & h_{2,4} = \tilde{h}_{24} + h_{2,4t}, & E_i = E_{it} e^{iWt} \\ \Delta_{13} = \tilde{\Delta}_{13} + \Delta_{13t}, & \Delta_{24} = \tilde{\Delta}_{24} + \Delta_{24t} \\ y_{1,3} = \tilde{y}_{13} + y_{1,3t}, & y_{2,4} = \tilde{y}_{24} + y_{2,4t}. \end{split}$$

Розкладемо коефіцієнти P_f і L_f в ряд по $\frac{y_{ft}}{2}$, обмежуючись лінійними доданками:

$$P_f = P_f^{(0)} + \frac{y_{ft}}{2} P_f^{(1)}, L_f = L_f^{(0)} + \frac{y_{ft}}{2} L_f^{(1)},$$
(2.7)

де використані такі позначення:

$$\begin{split} P_{1,3}^{(0)} &= \frac{1-a^2}{Z_{13}}, L_{1,3}^{(0)} = \frac{2a \ sh\tilde{y}_{13}}{Z_{13}}, P_{2,4}^{(0)} = \frac{1-a^2}{Z_{24}}, L_{2,4}^{(0)} = \frac{2a \ sh\tilde{y}_{24}}{Z_{24}}, \\ P_{1,3}^{(1)} &= -\frac{4a \ (1-a^2) sh\tilde{y}_{13}}{Z_{13}^2}, L_{1,3}^{(1)} = \frac{4a \ [2a \ +(1+a^2) ch\tilde{y}_{13}]}{Z_{13}^2}, \\ P_{2,4}^{(1)} &= -\frac{4a \ (1-a^2) sh\tilde{y}_{24}}{Z_{24}^2}, L_{2,4}^{(1)} = \frac{4a \ [2a \ +(1+a^2) ch\tilde{y}_{24}]}{Z_{24}^2}, \\ Z_{13} &= 1+a^2 + 2ach\tilde{y}_{13}, \quad Z_{24} = 1+a^2 + 2ach\tilde{y}_{24}, \\ \tilde{y}_{13} &= \frac{1}{2} ln \frac{1+\tilde{h}_{13}}{1-\tilde{h}_{13}} + bn_1^+\tilde{h}_{13} + bn_2^+\tilde{h}_{24}, \\ \tilde{y}_{24} &= bn_2^+\tilde{h}_{13} + \frac{1}{2} ln \frac{1+\tilde{h}_{24}}{1-\tilde{h}_{24}} + bn_3^+\tilde{h}_{24}, \end{split}$$

Параметри впорядкування \tilde{h}_{13} , \tilde{h}_{24} і деформації e_j знаходимо із наступної системи рівнянь:

$$\begin{split} \tilde{h}_{13} &= \frac{1}{D} [sh(\tilde{y}_{13} + \tilde{y}_{24}) + a^2 sh(\tilde{y}_{13} - \tilde{y}_{24}) + 2ash\tilde{y}_{13}], \\ \tilde{h}_{24} &= \frac{1}{D} [sh(\tilde{y}_{13} + \tilde{y}_{24}) - a^2 sh(\tilde{y}_{13} - \tilde{y}_{24}) + 2ash\tilde{y}_{24}], \\ - p &= c_{i1}^{E0} e_1 + c_{i2}^{E0} e_2 + c_{i3}^{E0} e_3 + c_{i5}^{E0} e_5 - \frac{2d_i}{u} + \frac{2d_i}{uD} M_e - \\ &- \frac{1}{4u} (y_{1i}^+ \tilde{h}_{13}^2 + 2y_{2i}^+ \tilde{h}_{13} \tilde{h}_{24} + y_{3i}^+ \tilde{h}_{24}^2), \\ 0 &= c_{15}^{E0} e_5 + c_{25}^{E0} e_5 + c_{35}^{E0} e_5 + c_{55}^{E0} e_{55} - \frac{2d_5}{u} + \frac{2d_5}{uD} M_e - \\ &- \frac{1}{4u} (y_{15}^+ \tilde{h}_{13}^2 + 2y_{25}^+ \tilde{h}_{13} \tilde{h}_{24} + y_{35}^+ \tilde{h}_{24}^2), \\ 0 &= c_{44}^{E0} e_4 + c_{46}^{E0} e_{66} - \frac{2d_4}{u} + \frac{2d_4}{uD} M_e - \\ &- \frac{1}{4u} (y_{14}^+ \tilde{h}_{13}^2 + 2y_{24}^+ \tilde{h}_{13} \tilde{h}_{24} + y_{34}^+ \tilde{h}_{24}^2), \\ 0 &= c_{46}^{E0} e_4 + c_{66}^{E0} e_6 - \frac{2d_6}{u} + \frac{2d_6}{uD} M_e - \\ &- \frac{1}{4u} (y_{16}^+ \tilde{h}_{13}^2 + 2y_{26}^+ \tilde{h}_{13} \tilde{h}_{24} + y_{36}^+ \tilde{h}_{24}^2), \end{split}$$

де використані позначення:

$$D = ch(\tilde{y}_{13} + \tilde{y}_{24}) + a^2 ch(\tilde{y}_{13} - \tilde{y}_{24}) + + 2ach\tilde{y}_{13} + 2ach\tilde{y}_{24} + a^2 + 1,$$
$$n_i^+ = n_i^0 + \sum_{j=1}^6 y_{ij}^+ e_j, \ a = \exp\left\{-b(w^0 + \sum_{j=1}^6 d_j e_j)\right\}.$$

 $M_e = 2a^2 ch(\tilde{y}_{13} - \tilde{y}_{24}) + 2a^2 + 2ach\tilde{y}_{13} + 2ach\tilde{y}_{24}$. Підставляючи розклади (2.6) і (2.7) в рівняння (2.4) і (2.5) та виключаючи параметри $\Delta_{13t}, \Delta_{24t}$, отримуємо диференціальні рівняння для залежних від часу унарних функцій розподілу дейтронів GPI. Розв'язуючи ці рівняння, отримуємо компоненти динамічної діелектричної сприйнятливості:

$$c_{11,33}^{e}(w) = c_{11,33}^{e0} + \lim \frac{1}{u} [m_{13}^{x,z} \frac{d(h_{1t} - h_{3t})}{dE_{1,3t}} - m_{24}^{x,z} \frac{d(h_{2t} - h_{4t})}{dE_{1,3t}}] = c_{11,33}^{e0} + \sum_{i=1}^{2} \frac{c_{i}^{x,z}}{1 + iwt_{i}^{x,z}},$$

$$c_{22}^{e}(w) = c_{22}^{e0} + \lim \frac{1}{u} [m_{13}^{y} \frac{d(h_{1t} + h_{3t})}{dE_{2t}} - m_{24}^{y} \frac{d(h_{2t} + h_{4t})}{dE_{2t}}] = c_{22}^{e0} + \sum_{i=1}^{2} \frac{c_{i}^{y}}{1 + iwt_{i}^{y}}.$$

Тут використані такі позначення:

$$\begin{split} c_{1,2}^{x,z} &= \frac{b}{2u} \frac{t_1^{x,z} t_2^{x,z}}{t_2^{x,z} - t_1^{x,z}} \{ \pm [(m_{13}^{x,z})^2 m_1 + (m_{24}^{x,z})^2 m_2] \mathbf{m} \\ & \mathbf{m} t_{1,2}^{x,z} [(m_{13}^{x,z})^2 m_1 m_{22}^- + (m_{24}^{x,z})^2 m_2 m_{11}^- \\ & - m_{13}^{x,z} m_{24}^{x,z} (m_1 m_{21}^- + m_2 m_{12}^-)] \}, \\ c_{1,2}^y &= \frac{b}{2u} \frac{t_1^y t_2^y}{t_2^y - t_1^y} \{ \pm [(m_{13}^y)^2 m_1 + (m_{24}^y)^2 m_2] \mathbf{m} \\ & \mathbf{m} t_{1,2}^y [(m_{13}^y)^2 m_1 m_{22}^+ + (m_{24}^y)^2 m_2 m_{11}^+ - \\ & - m_{13}^y m_{24}^y (m_1 m_{21}^+ + m_2 m_{12}^+)] \}, \\ (t_{1,2}^{x,z})^{-1} &= \frac{1}{2} [(m_{11} + m_{22}) \pm \sqrt{(m_{11}^- - m_{22}^-)^2 + 4m_{12}^- m_{21}^-}] \\ (t_{1,2}^y)^{-1} &= \frac{1}{2} [(m_{11} + m_{22}) \pm \sqrt{(m_{11}^- - m_{22}^-)^2 + 4m_{12}^- m_{21}^-}] \\ m_{11}^\pm &= \frac{1}{a} (1 - bn_1^\pm r_{13} K_{13}), m_{22}^\pm &= \frac{1}{a} (1 - bn_3^\pm r_{24} K_{24}), \\ m_{12}^\pm &= \frac{1}{a} [(1 + K_{13}) P_{13}^{(0)} + bn_2^\pm r_{13} K_{13}], \\ m_{21}^\pm &= \frac{1}{a} [(1 + K_{24}) P_{24}^{(0)} + bn_2^\pm r_{24} K_{24}], \\ m_1 &= \frac{1}{a} K_{13} r_{13}, m_2 &= \frac{1}{a} K_{24} r_{24}, \\ K_{13} &= \frac{P_{13}^{(1)} \tilde{h}_{13} + L_{13}^{(1)}}{2r_{13} - (P_{13}^{(1)} h_{13} + L_{13}^{(1)})}, K_{24} &= \frac{P_{24}^{(1)} \tilde{h}_{24} + L_{24}^{(1)}}{2r_{13} - (P_{24}^{(1)} h_{24} + L_{24}^{(1)})}, \\ r_{13} &= 1 - (\tilde{h}_{13})^2, r_{24} = 1 - (\tilde{h}_{24})^2. \end{split}$$

Динамічну проникливість затиснутого кристала GPI визначаємо таким чином:

$$e_{ii}^{\prime e}(w) = e_{ii}^{e0} + \sum_{i=1}^{2} \frac{4pc_i^a}{1 + (wt_i^a)^2}, (a = x, y, z)$$
$$e_{ii}^{\prime \prime e}(w) = \sum_{i=1}^{2} \frac{4pwt_i^a c_i^a}{1 + (wt_i^a)^2}.$$

II. Порівняння числових розрахунків з експериментальними даними

Для кількісної оцінки температурних і частотних залежностей відповідних фізичних характеристик кристала GPI, отриманих у рамках запропонованої теорії, необхідно задати значення таких параметрів:

- параметрів двочастинкового кластера w^0 ;

- параметрів далекосяжної взаємодії $n_1^{\pm}, n_2^{\pm}, n_3^{\times};$

- ефективних дипольних моментів $m_{13,24}^a$;

- деформаційних потенціалів δ_i , Y_{ii}^{\pm} ;

- "затравних" діелектричних сприйнятливостей $c_{ii}^{e0};$

- "затравних" коефіцієнтів п'єзоелектричної напруги e_{2i}^0 , e_{25}^0 ;

- "затравних" пружних сталих $c_{ii'}^{E0}$, c_{i5}^{E0} , c_{ij}^{E0} , $c_{46}^{E0};$

- параметра а, що визначає часову шкалу релаксаційних процесів.

Значення наведених параметрів теорії ми визначили при вивченні статичних властивостей GPI [1]. Для кристалу роботи [6], в якому температура фазового $w^0 / k_E = 820K;$ $T_{c} = 225K$ переходу $\tilde{n}_1^{0+} = \tilde{n}_2^{0+} = \tilde{n}_3^{0+} = 2,643K$, $\widetilde{n}_{1}^{0-} = \widetilde{n}_{2}^{0-} = \widetilde{n}_{3}^{0-} = 0,2K, \ \widetilde{n}_{i}^{0\pm} = n_{i}^{0\pm}/k_{E};$ $\tilde{d}_1 = 500K, \tilde{d}_2 = 600K, \tilde{d}_3 = 500K, \tilde{d}_4 = 150K,$ $\widetilde{d}_5 = 100K, \widetilde{d}_6 = 150K, \widetilde{d}_I = d_I/k_E;$ $\tilde{y}_{i1}^+ = 87.9K; \tilde{y}_{i2}^+ = 237.0K; \tilde{y}_{i3}^+ = 103.8K; \tilde{y}_{i4}^+ = 149K;$] $\tilde{y}_{i5}^{+} = 21,3K; \tilde{y}_{i6}^{+} = 143,8K; \tilde{y}_{il}^{+} = y_{il}^{+} / k_{B}.$

Ефективні дипольні моменти в парафазі дорівнюють $\mathbf{m}_{13} = (0,5;4,02;4,3) \cdot 10^{-18} o\partial. CFCE \cdot cM$,

 $\mathbf{m}_{24} = (2,5;3,0;2,2) \cdot 10^{-18} o\partial.C\Gamma CE \cdot cM$. B cerhetoелектричній фазі $m_{13}^y = 3,82 \cdot 10^{-18} o \partial. C \Gamma C E \cdot c M.$

Для кристала роботи [7] $T_c = 223K$ параметри w^0 , $n_1^{\pm}, n_2^{\pm}, n_3^{\pm}, \delta_i, y_{ii}^{\pm}, m_{13,24}^a$ слід перемножити на коефіцієнт 0.994.

Параметр а визначаємо з умови, щоб теоретично розраховані криві частотних залежностей e₂₂(w) узгоджувались з кривими, які отримано експериментально. При цьому передбачалось, що параметр а незначно змінюється з температурою:

$$a = [1, 6 - 0, 0011(\Delta T)] \cdot 10^{-14} c^{-1}, \quad \Delta T = T - T_c.$$

Об'єм примітивної комірки GPI взято рівним $u_2 = 0,601 \cdot 10^{-21} \,\mathrm{cm}^3$.

"Затравні"

$$\begin{split} e_{21}^{0} &= e_{22}^{0} = e_{23}^{0} = e_{25}^{0} = 0 \ o\partial. C\Gamma CE/cm^{2} \ , \\ c_{11}^{e0} &= 0,1; \quad c_{22}^{e0} = 0,403; \quad c_{33}^{e0} = 0,5; \\ c_{11}^{0} &= 26,91 \cdot 10^{10} \ \partial u H/cm^{2} \ , \ c_{12}^{E0} &= 14,5 \cdot 10^{10} \ \partial u H/cm^{2} \ , \\ c_{13}^{E0} &= 11,64 \cdot 10^{10} \ \partial u H/cm^{2} \ , \ c_{23}^{E0} &= 20,38 \cdot 10^{10} \ \partial u H/cm^{2} \\ c_{33}^{E0} &= 624,41 \cdot 10^{10} \ \partial u H/cm^{2} \ , \ c_{15}^{E0} &= 3,91 \cdot 10^{10} \ \partial u H/cm^{2} \ , \\ c_{25}^{E0} &= 5,64 \cdot 10^{10} \ \partial u H/cm^{2} \ , \ c_{35}^{E0} &= -2,84 \cdot 10^{10} \ \partial u H/cm^{2} \ , \\ c_{55}^{E0} &= 8,54 \cdot 10^{10} \ \partial u H/cm^{2} \ , \ c_{44}^{E0} &= 15,31 \cdot 10^{10} \ \partial u H/cm^{2} \ , \end{split}$$

с



Рис. 1. Залежності від ΔT дійсної e_{22}' і уявної e_{22}'' частин діелектричної проникності GPI при різних частотах v (*ГГц*): 0.015 – 1, •[7]; 0.23 – 2, ▲ [7]; 0.61 – 3, ▼ [7]; 2.0 – 4, ■ [7] і при різних значеннях гідростатичного тиску p (10⁹ $\partial uh/cm^2$): 0 - a; 1.7 - b; 3 -.c; частотні залежності e_{22}' і e_{22}'' при різних ΔT (K): 1.0 – 1; 2.0 -- 2, ; 5.0 – 3; ■ [17] і при різних значеннях гідростатичного тиску p (10⁹ $\partial uh/cm^2$): 0 - a; 1.7 - b; 3 -.c; частотні залежності e_{22}' і e_{22}'' при різних ΔT (K): 1.0 – 1; 2.0 -- 2, ; 5.0 – 3; ■ [17] і при різних значеннях гідростатичного тиску p (10⁹ $\partial uh/cm^2$): 0 - a; 1.7 - b; 3 – c; баричні залежності e_{22}' і e_{22}'' при різних ΔT (K): 1.0 – 1; 2.0 -- 2, ; 5.0 – 3 і при різних значеннях значеннях частоти n (*ГГц*): 0,015 – a; 0,23 – b; 2,0 – c.

 $\begin{aligned} c_{46}^{E0} &= -1.1 \cdot 10^{10} \, \partial u \mu / c M^2 , \ c_{66}^{E0} &= 11.88 \cdot 10^{10} \, \partial u \mu / c M^2 , \\ c_{22}^{E0} &= (65 - 0.04 \Delta T) \cdot 10^{10} \, \partial u \mu / c M^2 \end{aligned}$

На рис. 1 наведені залежності від ΔT дійсної $e'_{22}(n,T)$ і уявної $e''_{22}(n,T)$ частин динамічної діелектричної проникності при різних частотах кристала GPI і при різних значеннях гідростатичного тиску, а також дані експериментів роботи [7], частотні залежності e'_{22} і e''_{22} при різних ΔT і при різних значеннях гідростатичного тиску та баричні залежності e'_{22} і e''_{22} при різних ΔT і при різних значеннях значеннях частоти.

При збільшенні величини гідростатичного тиску макимальні значення дійсної e'_{22} і уявної e''_{22} частин діелектричної проникності GPI зменшуються і зміщуються в бік нижчих температур. При частотах менших частоти релаксації ($n_p \approx 8 \cdot 10^7 \, \Gamma$ ц) збільшення гідростатичного тиску, прикладеного до кристала, приводить до зростання дійсної e'_{22} і уявної e''_{22} частин діелектричної проникності GPI при різних ΔT і тим сильніше, чим менше значення ΔT . При частотах більших за n_p при зростанні гідроста-

тичного тиску максимуми e'_{22} і e''_{22} зменшуються при збільшенні ΔT і зміщуються в бік більших ΔT , а потім значення $e'_{22}(p)$ і $e''_{22}(p)$ стають більшими за $e'_{22}(0)$ і $e''_{22}(0)$.

На рис. 2 наведені залежності від ΔT дійсної $e'_{11}(n,T)$ і уявної $e''_{11}(n,T)$ частин динамічної діелектричної проникності кристала GPI при різних частотах і при різних значеннях гідроста-тичного тиску, частотні залежності e'_{11} і e''_{11} при різних ΔT і при різних значеннях гідростатичного тиску та баричні залежності e'_{11} і e''_{11} при різних ΔT і при різних значеннях значеннях частоти. Аналогічні залежності дійсної e'_{33} і уявної e''_{33} частин діелектричної проникності GPI зображені на рис. 3.

Характер залежності дійсної e'_{33} і уявної e''_{33} частин діелектричної проникності GPI від гідростатичного тиску є аналогічним до закономірностей впливу цього тиску на e'_{11} і уявної e''_{11} , тільки числові значення $e^*_{33}(n,T)$ в ≈ 10 разів більші, ніж $e^*_{11}(n,T)$. Поведінка дійсної e'_{11} і уявної e''_{11} частин діелектричної проникності GPI при прикладанні гідростатичного тиску залежить відхилення від температури фазового переходу ΔT і частоти n



частотах v (ГГи): 10.0 – 1; 20.0 – 2; 40.0 – 3 і при різних значеннях гідростатичного тиску p (10⁹ $\partial uh/cm^2$): 0 - a; 1.7 - b; 3 -.c; частотні залежності e'_{11} і e''_{11} при різних ΔT (К): 1.0 – 1; 5.0 -- 2, ; 10.0 – 3 і при різних значеннях гідростатичного тиску p, (10⁹ $\partial uh/cm^2$): 0 - a; 1.7 - b; 3 – c; баричні залежності e'_{11} і e''_{11} при різних ΔT (К): 1.0 – 1; 5.0 -- 2, ; 10.0 – 3 і при різних значеннях значеннях частоти n (ГГu): 1.0 – a; 3.0 – b; 6.0 – c, 10 – d; 20 – f; 40 – e.



частотах v (ГГ μ): 10.0 – 1; 20.0 – 2; 40.0 – 3 і при різних значеннях гідростатичного тиску p (10⁹ $\partial u h / c M^2$): 0 - a; 1.7 - b; 3 -.c; частотні залежності e'_{33} і e''_{33} при різних ΔT (К): 1.0 – 1; 5.0 -- 2, ; 10.0 – 3 і при різних значеннях гідростатичного тиску p, (10⁹ $\partial u h / c M^2$): 0 - a; 1.7 - b; 3 – c; баричні залежності e'_{33} і e''_{33} при різних ΔT (К): 1.0 – 1; 5.0 -- 2, ; 10.0 – 3 і при різних значеннях гідростатичного тиску p, (10⁹ $\partial u h / c M^2$): 0 - a; 1.7 - b; 3 – c; баричні залежності e'_{33} і e''_{33} при різних ΔT (К): 1.0 – 1; 5.0 -- 2, ; 10.0 – 3 і при різних значеннях значеннях частоти n (ГГ μ): 1.0 – a; 3.0 – b; 6.0 – c, 10 – d; 20 – f; 40 – e.



Рис.4. Криві Коул - Коула при різних ΔT (К):- 1.0 - 1, □ [7]; 2.0 -- 2, □ [7]; 5.0 - 3, □ [7] і при різних значеннях гідростатичного тиску *p*, (10 ⁹ dyn/cm ²): 0 - а; 1.7 - b; 3 - с.



Рис. 5. Температурні залежності обернених часів релаксації $(t_1^y)^{-1}$ і $(t_1^{x,z})^{-1}$ при різних значеннях гідроста-тичного тиску p, (10^9 dyn/cm^2) : 0 - 1; 1.7 - 2; 3.0 - 3.

зовнішнього електричного поля. При малих значеннях ΔT і дорелакційних частотах збільшення тиску приводить до значного нелінійного зростання проникностей e'_{11} і e''_{11} , причому збільшення ΔT приводить до зменшення проникностей. В області релаксаційних частот при збільшенні тиску проникності спочатку зростають, а потім зменшуються, а максумум проникностей при збльшенні частот зсувається в область менших тисків. При частотах більших за релаксаційні частоти збільшення тиску зумовлює зменшення проникностей e'_{11} і e''_{11} і збільшення ΔT приводить до збільшення проникностей.

На рис.4 наведені криві Коул - Коула при різних ΔT і при різних значеннях гідростатичного тиску. Для всіх випадків радіуси півкіл Коул - Коула зменшуються при збільшенні тиску і ΔT .

Температурні залежності обернених часів релаксації $(t_1^y)^{-1}$ і $(t_1^{x,z})^{-1}$ при різних значеннях гідростатичного тиску зображені на рис.5. Мінімальні значення цих величин з ростом гідростатичного тиску зміщуються в бік нищих температур, числові значення $(t_1^y)^{-1}$ з тиском зменшуються, а $(t_1^{x,z})^{-1}$ не змінюються.

Висновки

В даній роботі в рамках модифікованої моделі протонного впорядкування квазіодновимірних сегнетоелектриків з водневими зв'язками типу GPI з врахування в сегнетоелектричній фазі п'єзоелектричного зв'язку з деформаціями e_i , e_j в наближенні двочастинкового кластера вивчено вплив гідростатичного тиску на температурні і частотні залежності компонент динамічної діелектричної проникності сегнетоелектрика GPI. Встановлено, що гідростатичний тиск збільшує час релаксації t_1^y , внаслідок чого частотна залежність діелектричної проникності зсувається до нижчих частот.

Зачек І.Р. - доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики; Левицький Р.Р. - доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник; Вдович А.С. - кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник.

- [1] I.R. Zachek, Ya. Shchur, R.R. Levitskii, A.S. Vdovych, Physica B 520, 164 (2017).
- [2] I.R. Zachek, R.R. Levitskii, A.S. Vdovych, I.V. Stasyuk, Conden. Matt. Phys. 20(2), 23706 (2017).
- [3] J. Glauber, J. Math. Phys.4(2), 294 (1963).
- [4] Р.Р. Левицький, І.Р. Зачек, А.С. Вдович, ФХТТ 10(2), 377 (2009).
- [5] R.R. Levitskii, I.R. Zachek, A.S. Vdovych, Conden. Matt. Phys. 15(3), 33705(2012).
- [6] S. Dacko, Z. Czapla, J. Baran, M. Drozd, Phys.Lett. A 223, 217 (1996).
- [7] R. Tchukvinskyi, Z. Czapla, R. Sobiestianskas, A. Brilingas, J. Grigas, J. Baran, Acta Phys. Polonica A 92, 1191 (1997).

I.R. Zachek¹, R.R. Levitskii², A.S. Vdovych²

Hydrostatic Pressure Effect on Relaxation of Quasi-One-Dimensional GPI Ferroelectric

¹Lviv Polytechnic National University 12 Bandery Street, 79013, Lviv, Ukraine ²Institute for Condensed Matter Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine 1 Svientsitskii Street, 79011, Lviv, Ukraine

Dynamic model of deformed quasi-one-dimensional ferroelectrics with hydrogen bonds is proposed. On the basis of this model within the two-particle cluster approximation with taking into account short-range and long-range interactions and strains ε_i and ε_5 in the frames of Glauber method a dynamic dielectric permittivity of mechanically clamped crystal is calculated. Hydrostatic pressure effect on temperature and frequency dependences of the components of dynamic dielectric permittivity tensor of GPI ferroelectric is investigated. **Key words:** ferroelectrics, cluster approximation, dynamic dielectric permittivity, hydrostatic pressure.